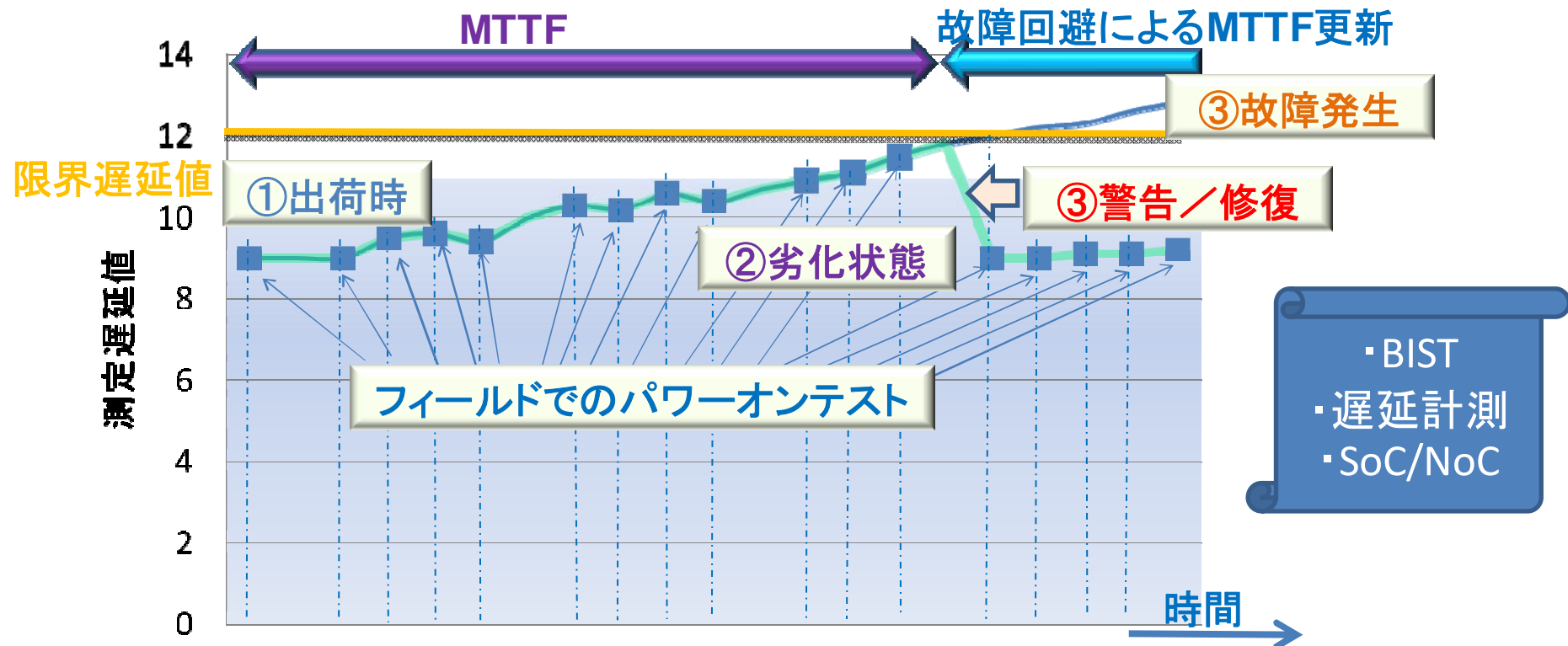


フィールド高信頼化のための回路・システム機構

研究代表者: 梶原誠司 (九州工業大学)

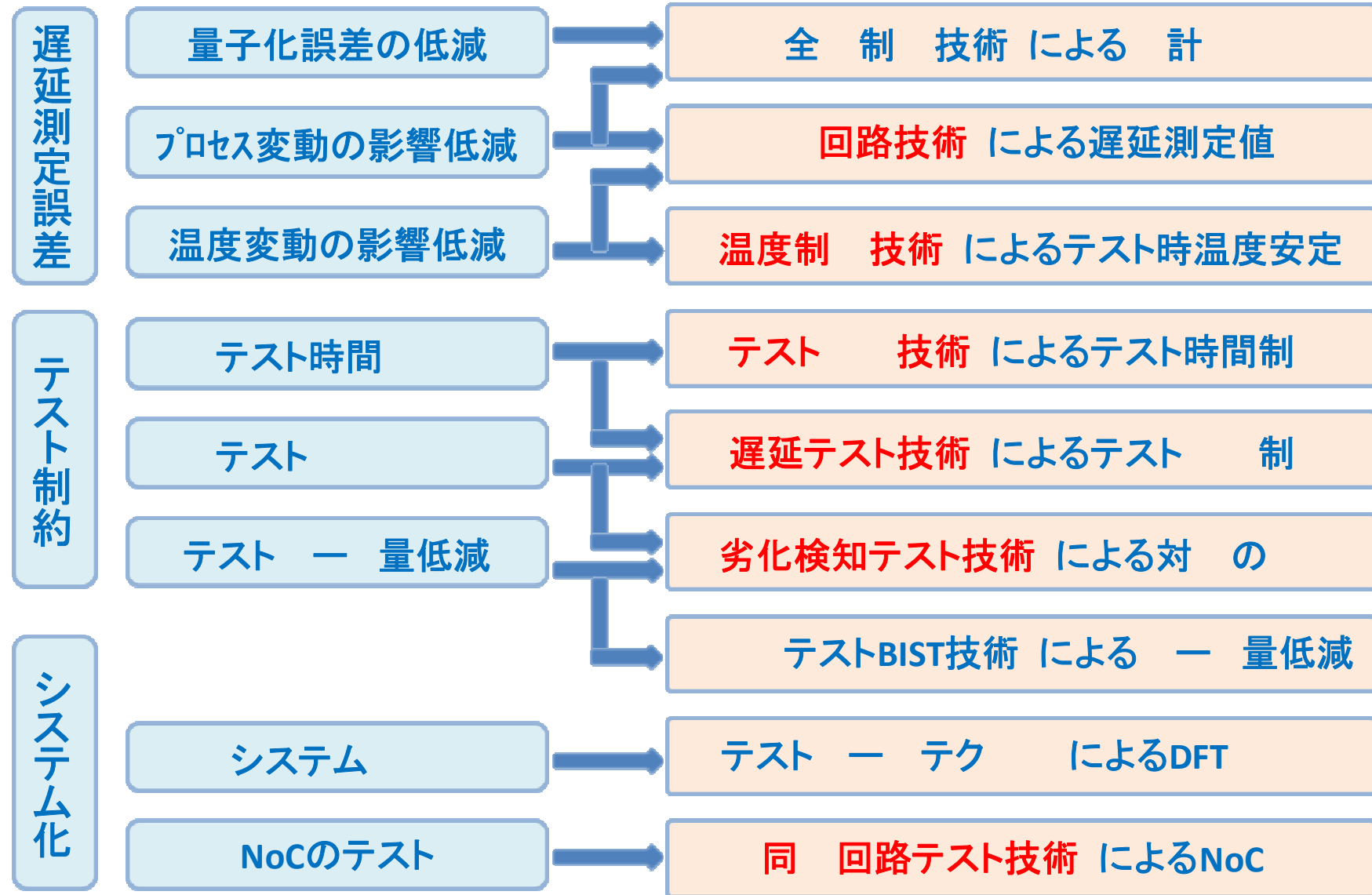
主たる共同研究者: 藤原秀雄 (奈良先端科学技術大学院大学)、三浦幸也 (首都大学東京)

研究目的: 突然のシステムダウンを回避し、安全・安心なシステムに。
実現方法: フィールドにおけるVLSIの**パワーオン・オフテスト**による劣化検知・故障検出・診断・修復



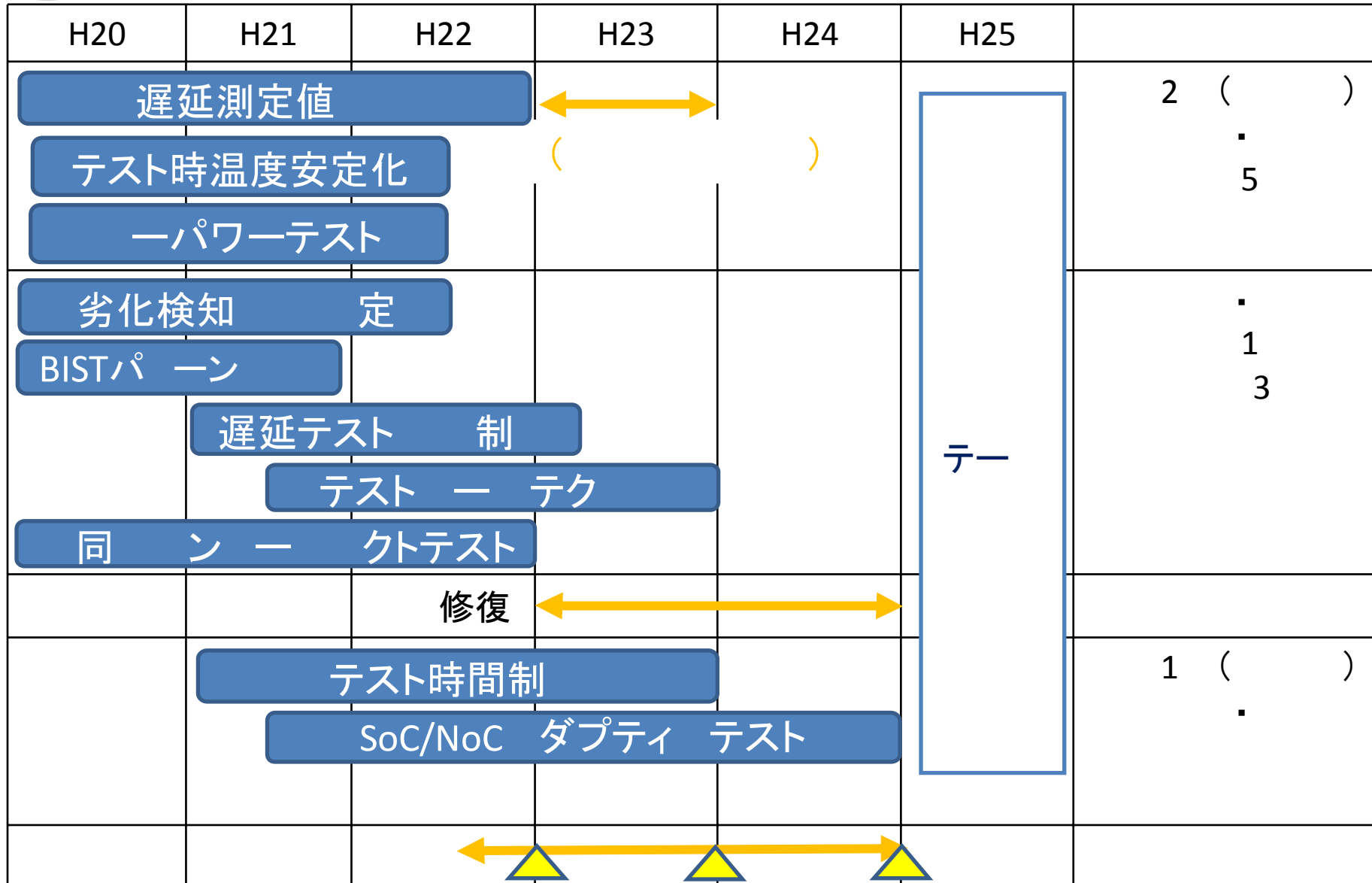


技術課題と対応戦略





研究 発計 と





業 (5 -7回)と の方

■ フィールドでのLSIテストの現状

- ーテスト, フトウ テスト, フ ンクションテスト, BISTによる テスト , 実 .
- し し, 劣化を したテスト 測定 度に , 発 .

■ の方

- プ ーションによるテスト制約の の
 - . : テスト時間, 低 スト(, ン),
 - ットワーク: , 動 ー
 - プ ント制 : フ ール ーフ, , LSIの プ ース
- の生 テスト の
 - 回路 のテスト ースの共
 - 高 度テスト, 時間テスト の応